

AGENDA, MITTWOCH, 12.10.2011

09:30 – 10:30	Begrüßung: Michael Dams, Director Central Europe, National Instruments Germany GmbH Keynote: Prof. Dr.-Ing. Ulrich Wagner, Vorstand für Energie und Verkehr am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.								
10:30 – 11:00	Kaffeepause/Besuch der Ausstellung								
	Stadtssaal	Kleiner Saal	Säulensaal	Saal 1	Saal 5	Neue Bühne Bruck	Fürstenfelder 2&3	Saal 3	Saal 6
	LabVIEW Power Programming	Prüfstandsautomatisierung	Mess- und Prüftechnik	Big Physics	Embedded Systemdesign und Validierung	Design & Test im Automobilbereich	Design & Test in Aerospace/Defense	Workshops für Einsteiger	Workshops für Fortgeschrittene
11:00 – 11:30	Vernetzung von Systemen mit LabVIEW Christian Mergl, National Instruments Germany GmbH	TestStand meets UML Jürgen Dodek, MTU Friedrichshafen GmbH	Why you should choose the NI measurement platform Andy Deck, National Instruments Corp.	Von CERN bis ITER: Kommerzielle Standardprodukte und -technologien in physikalischen Großforschungseinrichtungen Christoph Wimmer, National Instruments Corp.	Herausforderungen an die Inverterprüfung von automobilen Steuergeräten Karsten Fuchs, Lear Corporation GmbH & Co. KG	The Past, Present and Future of Automotive Chris Washington, National Instruments Corp.	Improving Life-Cycle Management for Testing Aerospace and Defence Electronics David Hall, National Instruments Corp.	Einführung in LabVIEW Stefan Egeler, National Instruments Germany GmbH	Automatisierte Testsysteme mit LabVIEW und PXI Carsten Skopke, National Instruments Germany GmbH
11:30 – 12:00		Teststandsdesign für Brennstoffzellen-KVKs: Herausforderungen und Lösungen Johannes Ott, CGS – Computer Gesteuerte Systeme GmbH, Frank Erne, elcomax GmbH	New products for your measurements National Instruments Corp.		Validierung auf Systemebene von Anfang an Stephan Ahrends, National Instruments Germany GmbH	Elektro-Motor-Emulation: PowerHIL – Dynamische Inverterprüfung mit System Frank Heidemann, SET GmbH – Smart embedded Technologies			
12:00 – 12:30	Codegenerator für das Erstellen einer Vi-Hierarchie aus Structured-Design-Diagrammen mit Vi-Scripting Jürgen Bulthz, Oliver Frank Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH	Re-Automatisierung eines Prüfstandes in der Automobilzulieferindustrie: Durchgängige Systemlösung CompactRIO und LabVIEW Jochen Weber, ProNES Automation GmbH	Entwicklung einer automatisierten Vierpolmess-apparatur zur Bestimmung der elektrischen Widerstände Christian Heiske, Zentrum für Brennstoffzellen-Technik ZBT GmbH		Automatische Testfallgenerierung für den Systemtest Dr. Martin Beißer-Dresel, sepp.med GmbH	DEUTZ Evaluation Tool zur Motorversuchsdatenauswertung mit DIAdem und X-Frame Dr. Michael Röbel, Deutz AG, Thomas Irmen, measX GmbH & Co. KG	Automated Microvibration Measurements on Spacewheels Used for Stabilized Attitude Control of Satellites Andreas Hergesell, MetaDAQ – Ingenieurbüro für innovative Messtechnik	PC-basierte Datenerfassung mit LabVIEW Stefan Egeler, National Instruments Germany GmbH	Deterministische Anwendungen mit LabVIEW Real-Time Carsten Skopke, National Instruments Germany GmbH
12:30 – 13:00	Programmieren ohne Maus und Tastatur: LabVIEW und Vi-Scripting per Spracheingabe Udo Weik, Ingenieurbüro Weik	Mittagsbuffet/ Besuch der Ausstellung	TUTORIUM: Datenerfassung verstehen mit LabVIEW Sascha Egger, National Instruments Switzerland	Mittagsbuffet/ Besuch der Ausstellung	Mit grafischem Systemdesign zum rein elektrisch angetriebenen Rennwagen Rick Weiß, ELBFLOTRACE Formula Student Team TU Dresden e.V.	Mittagsbuffet/ Besuch der Ausstellung	Test Automation Using the ATML Standard Dr. Andras Ferencz, Naturen Ltd.		
13:00 – 14:00		Miniatursiertes Infrarotspektrometer zur Ölstandüberwachung von Windkraftgetrieben auf NI Single-Board RIO 9632 Benjamin Wiesent, TU München	Mittagsbuffet/ Besuch der Ausstellung	Steuerung der Wasserkühl-anlage in der mechanischen Bremse eines 220 MVA Schwungrad-Generators Alexander Sigalov, C.-P. Kasemann, I. Goldstein Max-Planck-Institut für Plasma-physik, Euratom Assoziation	Mittagsbuffet/ Besuch der Ausstellung	Lebensdauersimulation für Steuergeräte mit NI Single-Board RIO Michael Rost, IRS Systementwicklung GmbH	Mittagsbuffet/ Besuch der Ausstellung	Mittagsbuffet/ Besuch der Ausstellung	Mittagsbuffet/ Besuch der Ausstellung
14:30 – 15:00	LabVIEW Software Engineering Jonah Paul, National Instruments Corp.	Kontinuierliche und zeitsynchrone Signalüberwachung in der Prüfstandsautomatisierung – Vorstellung einer echtzeitfähigen Lösung für ein universelles Testsystem für CAN, LIN und FlexRay Ronald Kaempf, WKS Informatik GmbH	TUTORIUM: Messgerätesteuerung mit LabVIEW Andreas Scholz, National Instruments Germany GmbH	Entmagnetisierung magnetischer Abschirmkammern Detlef Stollfuß, Daniel Dreyer, Physikalisch-Technische Bundesanstalt	Grafisches Systemdesign in Theorie und Praxis: Plattformübergreifend entwickeln – vom PXI über Microcontroller/DSP zum FPGA Marco Schmid, Schmid Engineering AG	Restbussimulation mit Hard- und Software von NI Andreas Stark, National Instruments Germany GmbH	Entwurf medizintechnischer Geräte Messung und Regelung in der Kapselendoskopie mit PXI und LabVIEW Real-Time Mario Bechtold, Dr. Aleksandar Juloski, Siemens AG	Grundlagen in LabWindows/CVI Jan Wagner, National Instruments Germany GmbH	Maschinenzustandsüberwachung mit LabVIEW und CompactRIO Alexander Glasner, National Instruments Germany GmbH
15:00 – 15:30		Energieoptimierung mit neuartigen digitalSTROM-Modulen von der Entwicklung bis zur Fertigung durchgängig geprüft mit einer PXI-basierten Testplattform Markus Solbach, Noffz Computer Technik GmbH, Paul Buchmeier, digitalSTROM	Mobiler Mechatronikversuch: Leistungs- und Wirkungsgradmessung an einer Motor-Getriebe-Einheit Bernhard Decker, Fachhochschule Bingen	3D-Visualisation of Magnetic Fields for the Karlsruhe Neutrino Experiment KATRIN Armen Beglarian, Karlsruher Institut für Technologie		Neue Anforderungen in der Bordnetzkomunikation – Werkzeuge und Lösungen von NI Roland Magolei, National Instruments Engineering GmbH & Co. KG	Using LabVIEW for Regulated Medical Test Systems Greg Crouch, National Instruments Corp.		
15:30 – 16:00	Kaffeepause/Besuch der Ausstellung								
16:00 – 16:30	Design Pattern – Mit Vorlagen zu strukturiertem LabVIEW-Code Christian Mergl, National Instruments Germany GmbH	Kompensation kritischer, nicht-linearer Systemeigenschaften – der Schlüssel zum optimalen Betrieb geregelter Prüfstände Michael Unger, ITK Engineering AG	TUTORIUM: Signalkonditionierung Sascha Egger, National Instruments Switzerland Corp.	FPGA-based operation of in-vessel pressure gauges for nuclear fusion devices Andrea Scarabosio, Max-Planck-Institut für Plasmaphysik	LISARD: Programmierbarer Rechenkern für rechenintensive Echtzeitdatenverarbeitung mit PXI-RIO Dr.-Ing. Alexander Pacholik, Technische Universität Ilmenau	Steuergerätestester für Krauss Maffei Wegmann auf Basis von PXI und FPGA Dr. Joachim Hilsmann, measX GmbH & Co. KG	LabVIEW in lebenserhaltenden medizinischen Geräten Andreas Zimmer, XON Software GmbH, Holger Chab, Hepa Wash GmbH	Industrielle Bildverarbeitung mit dem VisionBuilder for Automated Inspection (VBAI) Jan Wagner, National Instruments Germany GmbH	Projekte mit der CompactDAQ-Plattform und LabVIEW FPGA Carsten Skopke, National Instruments Germany GmbH
16:30 – 17:00	Dynamische Analyse und Test von LabVIEW-Projekten Lutz Andrews, Siemens AG, Torsten Will, Data Ahead GmbH	Interprete für skriptgesteuerte Prüfabläufe auf CompactRIO und LabVIEW Peter Schwarz, A.M.S. Software GmbH Reinhard Kaufmann, Miele & Cie. KG	Echtzeitdatenerfassung mit CompactRIO in rauer Polarumgebung Wolfram Koerver, S.E.A. Datentechnik GmbH	FPGA-based Real-Time Monitoring and Feedback Control of a Single Atom Trajectory Christian Sames, Max-Planck-Institut für Quantenoptik	LabVIEW FPGA Under the Hood Jonah Paul, National Instruments Corp.	Universelles Prüfstandskonzept für die Qualitätssicherung in der Fertigung von Automotive-Komponenten Holger Müller, a-solution GmbH	Echtzeit-Testsystem für Herzschrittmacher und Defibrillatoren mit FPGA-Kommandointerpreter Ulrich Tietze, Christian Wienhold, Biotronik SE & Co. KG		
17:00 – 17:30	LabVIEW im Browser – Web-basierte Interfaces mit dem Web UI Builder Ruedi von Aarburg, Zühlke Engineering GmbH	Mess-, Steuer- und Regelungsaufgaben effizient gelöst mit der Werkzeugkette LabVIEW, cPCI und PXI an hochdynamischen Lenkungsprüfständen der ThyssenKrupp Presta AG Hans-Georg Herrmann, ExpertControl GmbH, Sonke von Heymann, ThyssenKrupp Presta AG	TUTORIUM: Fallstricke präziser DC-Messungen Moritz Mayer, National Instruments Germany GmbH	Echtzeitregelung von Fallstricken auf Basis der NI-Produktplattform Dr. Gerd Schmitz, S.E.A. Datentechnik GmbH, Carsten Stein, Werum – Software & Systems AG		Entwicklungsbegleitendes Testen intelligenter Motorkomponenten Dr. Michael Haug, EUTECH Scientific Engineering GmbH	Erfassung von Daten gemäß CFR21 Part 11 Reduzierung des Validierungsaufwandes dank LabVIEW Alessandro Sebaste, Noser Engineering AG		
17:30	Pils vom Fass im Ausstellungsbereich								
19:00	PARTY								

AGENDA, DONNERSTAG, 13.10.2011

09:00 – 10:30	Keynote: Rahman Jamal, Technical & Marketing Director Europe Live-Demonstrationen neuer Technologien und Produkte aus dem R&D-Center von National Instruments								
10:30 – 11:00	Kaffeepause/Besuch der Ausstellung								
	Stadtssaal	Kleiner Saal	Saal 5	Neue Bühne Bruck	Saulensaal	Fürstenfelder 2&3	Saal 1	Saal 3	Saal 6
	LabVIEW Power Programming	Fertigungs- und Baugruppentest	Business-Trends	Robotik und Mechatronik	Technisches Daten-Management	RF- und Wireless-Test	Halbleitertest	Workshops für Einsteiger	Workshops für Fortgeschrittene
11:00 – 11:30	Leistungs- & Geschwindigkeitssteigerung von LabVIEW-Projekten Moritz Mayer, National Instruments Germany GmbH	Trends and Key Technologies – NI Automated Test Outlook 2011 David Hall, National Instruments Corp.	Der optimale Businessplan – nicht nur für Unternehmer! Wer ihn braucht und was er bringt Günter Propster, Investment Manager, Asachi Capital GmbH	NI in Robotics – Übersicht über Plattformen, Partner und Initiativen Christian Fritze, National Instruments Corp.	Die Qualität der Daten – Der Schlüssel für ein effizientes Datenmanagement Andreas Haub, National Instruments Engineering GmbH & Co. KG	Trends und Schlüsseltechnologien in RF-Design und -Test Ted Miracco, National Instruments Corp. Christian Gindorf, National Instruments Germany GmbH	Semiconductor Test Applications and Trends Heath Noxon, National Instruments Corp.	Einführung in LabVIEW Stefan Egeler, National Instruments Germany GmbH	Automatisierte Testsysteme mit LabVIEW und PXI Carsten Skopke, National Instruments Germany GmbH
11:30 – 12:00		Prüflösungen mit hohem Automatisierungsgrad auch bei kleinen Losgrößen Christoph Ostermoller, BMK professional electronics GmbH	Business Design – A Systematic Approach to Create New Ventures Dr. Helmut Schönenberger, Geschäftsführer, Unternehmer-TUM GmbH	Umsetzung eines Online-SLAM-Verfahrens auf der Roboterplattform VolksBot-Lab Frank Engelhardt, Dr. Ansgar Breidenfeld, Otto-von-Guericke Universität Magdeburg	openMDM: DIAdem als Teil einer offenen Softwareplattform für Versuchs- und Messdatenmanagement Dr. Hans-Jörg Kremer, Peak-Solution GmbH		Einsatz von FPGA-Modulen zur parallelen Vermessung von mikromechanischen Inertialsensoren auf Waferebene Dr. Oliver Schwarzelbach, Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie		
12:00 – 12:30	Neuerungen in LabVIEW Daniel Riedelbauch, National Instruments Germany GmbH	JTAG/Boundary Scan – Effektiver Baugruppentest vom Prototyp bis zum Serientest Martin Borowski, Göpel electronic GmbH	Cost Reduction by Reuse from Validation to Production – Find Synergy between Test Departments to Reduce Cost and Optimize Time to Market Kevin Bisking, Senior Test Manager, National Instruments Corp.	Embedded Robotics mit LabVIEW – Neue Robot-Controllerboards powered by LabVIEW Marco Schmid, Schmid Engineering AG Stefan Enderle, qix robotics	DIAdem 2011: Vorstellung der neuen Version und Möglichkeit zum direkten Erfahrungsaustausch mit der DIAdem-Entwicklung Walter Rick, National Instruments Engineering GmbH & Co. KG	Kalibration von GSM/WCDMA-Modulen Martin Erker, peiker acoustic GmbH & Co. KG	Fehler gezielt zufällig finden? Verifikation von Halbleitern mit zufallsbedingten Testmethoden unter Verwendung des KT-7500 Mixed Signal Testers Michael Konrad, Konrad GmbH	Messgerätesteuerung mit LabVIEW Stefan Egeler, National Instruments Germany GmbH	Deterministische Anwendungen mit LabVIEW Real-Time Carsten Skopke, National Instruments Germany GmbH
12:30 – 13:00		Mittagsbuffet/ Besuch der Ausstellung	Grundzüge des Change Managements – Mitarbeiter motivieren & Widerstände auflösen in Zeiten des Wandels Georg Plasswilm, Regional Sales Manager, National Instruments Germany GmbH	Mittagsbuffet/ Besuch der Ausstellung		Mittagsbuffet/ Besuch der Ausstellung	LabVIEW, TestStand und PXI – Die ideale Kombination zur Reduzierung des Validierungsaufwands Heribert Erhart, Texas Instruments Deutschland GmbH		
13:00 – 14:00									
14:00 – 14:30	Mittagsbuffet/ Besuch der Ausstellung	IP to the Pin – FPGA-basierte Datenerfassung mit FlexRIO Christoph Landmann, National Instruments Germany GmbH	Mittagsbuffet/ Besuch der Ausstellung	Modellprogrammierte Roboter-Regelung Dr. Michael Hofbauer, UMIT – Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik GmbH	Mittagsbuffet/ Besuch der Ausstellung	Testen von RF-Leistungsverstärkern Martin Breinbauer, TriQuint Semiconductor GmbH	Mittagsbuffet/ Besuch der Ausstellung	Mittagsbuffet/ Besuch der Ausstellung	Mittagsbuffet/ Besuch der Ausstellung
14:30 – 15:00	LabVIEW-Anwendertreffen Moritz Mayer, National Instruments Germany GmbH, Jonah Paul, National Instruments Corp.	Universeller Sensorstertest als Plattformentwicklung für MTS – SSI, EtherCAT, CAN unter Verwendung von PXI, FPGA, RT und weiteren NI Technologien Markus Solbach, Noffz Computer Technik GmbH	Energieeffizienz und -verteilung Smart-Grid-Technologien von National Instruments für effiziente Energienutzung und -verteilung Klaus Dinnes, National Instruments Germany GmbH	Mobile Diagnostic Robot: A New Frontier for a Flexible Test Platform. Cristina Cristalli, Gruppo Loccioni	Data Management for MS Excel Users Derrick Snyder, National Instruments Corp.	Prüfadaptionen für RF- und Wireless-Test Dr. Gerald Oberschmidt, Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe	Structural & Physical Test The Modern Approach to Structural and Physical Test Andy Deck, National Instruments Corp.	Interaktives Datenmanagement und Berichterstellung mit DIAdem Jan Wagner, National Instruments Germany GmbH	Fortgeschrittene Benutzeroberflächengestaltung in LabVIEW Christian Mergl, National Instruments Germany GmbH
15:00 – 15:30		Schnelles, effektives und kostengünstiges Prüfen mittels datenbankbasierter Testautomatisierung über Abteilungs-grenzen hinweg Ronald Kaempf, WKS Informatik GmbH, Patrick Stelzer, Liebherr Elektronik GmbH	Energieeffizienz im Maschinen- und Anlagenbau – Weichenstellung in der mechatronischen Entwicklung Dr. Bernhard Kausler, ITQ GmbH	ERUPT®: Unmanned Heterogeneous Robot with Integrated Mission Control Fabio D'Aniello, Robotronix S.r.l.	Heizungsoptimierung mit DIAdem Stefan Müller, eodac Messtechnik	Die drei RF-Messungen, die jeder kennen sollte! Christian Gindorf, National Instruments Germany GmbH	Flexible, High-Performance Ultrasonic Array Data Acquisition and Real-Time Imaging on a PXI Platform Dave Lines, Diagnostic Sonar Ltd.		
15:30 – 16:00	Kaffeepause/Besuch der Ausstellung								
16:00 – 16:30	LabVIEW Tipps & Tricks Derrick Snyder, National Instruments Corp.	Systemtests an Brandmelder- und Löschstuerzentralen unter Verwendung von LabVIEW und TestStand auf einem PXI-System Mirko Hays, Sven Ehrich, Minimax GmbH & Co. KG	Home Energy Simulator – Entwicklung intelligenter Energiemanagementsysteme Dr.-Ing. Michael Haug, EUTECH Scientific Engineering GmbH	Pegasus – The Efficient Modular Running Robot Antonio Cherubini, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich	Messungen automatisch verketten, validieren und korrigieren – kein Problem mit DIAdem Karl Finkl, a-solution GmbH	RF-Referenzarchitekturen Ken Tobler, National Instruments Germany GmbH	Experimental Modal Analysis Demonstrated Using a Machine Base Example Kai-Uwe Kohn, CAE Software und Systems GmbH	PC-basierte Datenerfassung mit LabVIEW Stefan Egeler, National Instruments Germany GmbH	VI-Scripting – LabVIEW programmiert sich selbst Christian Mergl, National Instruments Germany GmbH
16:30 – 17:00		Reduzierung der Zykluszeiten von Pincheck und Hochspannungsprüfungen für Automotive-Steckverbinder unter Verwendung von modularer FPGA-Technologie Herbert Pichlik, Systec Gesellschaft für Automatisierung, Systeme und Technische Dokumentation mbH	Entwicklung des LabVIEW-Real-Time-Prozessdatensimulators ProDaS für Funktionstest und Analyse der Siemens Kraftwerkstechniksoftware Martin Knoll, evosoft GmbH	Machines that Work: Advanced Motion Control Techniques Jan Braun, maxon motor AG	Signalmustererkennung in großen Datenbeständen Andreas Haub, National Instruments Engineering GmbH & Co. KG	Laborgestützte Validierung von satellitengestützten Ortungs- und Navigationssystemen in der Verkehrstelematik Manuel Bogedain, Noffz Computer Technik GmbH Prof. Oliver Michler, TU Dresden	Fiber-Optical Sensing Systems – Challenges and Solutions Manfred Resch, INFAP GmbH		
17:00	ENDE								